

解决方案
展示

EXPO合作
企业展示

图像处理关联
研讨会

EXPO合作企业展示区域

CCS 合作公司的视觉检测解决方案

OKI



JE International corporation

computar

TPC
MACHINE VISION LENS

Next Technology

BASLER

FANATIC

Hutzper

MITSU
ミツテック株式会社

MICRO-TECHNICA

icore
innovation to the Core

VICO imaging.com

VOMMA

WHEC

解决方案
展示

EXPO合作
企业展示

图像处理关联
研讨会

EXPO合作企业展示区域

有益于解决图像处理检测难题的技术应用研讨会

- 12月4日(三) 10:30~11:30 “光源管理最新技术和新型控制器OPPX的介绍”
13:30~15:00 “图像处理检测中光源的作用 基础编”
- 12月5日(四) 10:30~11:30 “针对有图像导入想法的客户介绍解决方案(AI)”
13:30~14:30 “光源+α问题解决! 方案实例介绍 Part2”
- 12月6日(五) 10:30~11:30 “SWIR & 深紫外研讨会”
13:30~15:00 “图像处理检测中光源的作用 基础编”

注意事项

- 所有研讨会均以日语进行。研讨会需提前预约。想参加的请跟销售代表垂询或发邮件至 marcom@ccs-inc.co.jp。
- 内容详情，请跟销售代表垂询。
- 根据实际情况，研讨会的内容可能会有所变动。



登录网页预约观展申请!

申请表: https://e-ve.event-form.jp/event/87865/expo2024yokohama_global
为避免会场过度拥挤，我们将限制入场人数，来访前请提前申请。名额有限，预约从速。



CCS China Inc. 总部
中国广东省深圳市南山区粤海街道高新科技园南区南一道006号TCL大厦四层北侧A407
邮编518057
TEL. +86-755-8279-0477
FAX. +86-755-8279-0478

CCS China Inc. 上海分公司
中国上海市静安区嘉里不夜城A座2006室
(天目西路218号) 邮编200070
TEL. +86-21-5835-8728
FAX. +86-21-5835-8928

京都总部(京都, 日本)
TEL: +81-75-415-8284, FAX: +81-75-415-8316
E-mail: sales@ccs-inc.co.jp
<https://www.ccs-grp.com/>

Copyright © 2024 CCS Inc. All Rights Reserved. Content current as of Sep 2024. CHA-0036-2409



Machine Vision Solution

EXPO 2024 in 横浜

在展会3天, 发现“可见”

2024

12/4~6

(三) (五)

10:00~17:00

※最后入场时间 16:00

横滨新都市大厦9楼新都市大厅

- 神奈川县横滨市西区高岛2-18-1横滨新都市大厦9楼 (SOGO横滨店)
•从横滨站步行5分钟
JR线、京急线、东急东横线、相模铁道线、横滨市营地下铁线、港未来线
•从Pacifico Yokohama步行20分钟

日程

场地

从横滨站东口步行一小段距离



解决方案展示

我们将展出40多种与检测测量相关的解决方案!

LIGHTING SOLUTION
CCS 株式会社

图像处理关联研讨会

敝司将举办有关图像处理技术的研讨会。
* 研讨会将用日语进行。

EXPO合作企业展示

敝司的合作公司也将展出他们自己的机器视觉解决方案。

展览内容详情请参内页。

展品40种以上！CCS“最新”解决方案展示！

将展出多款新产品和解决方案！

“可见” “可解决” 我们准备了各种各样的解决方案。

3D & 传感器区域

▶ 3D测量解决方案 **NEW**

展示使用GigE相机的光学切割法进行3D测量。根据要检测的对象物进行合适的光学设置，可获得最佳的3D数据。

波长解决方案区域

▶ 最新SWIR *1 深紫外应用检测案例 **NEW**

■ 超高功率红外光源 (1120nm)

比传统1000nm以上红外光源HLV-IR120亮100倍以上。

*2 亮度高，可用于解决目前检测困难的案子，可提高检测速度。

■ 深紫外~近紫外应用检测案例

可见光范围有望用于目前难以实现的透明物体的可视化，表面伤痕，脏污，斑点等的检测。有关深紫外区域的应用实例，将使用相机，镜头等光学成像器件进行展示。

*1 Short Wavelength InfraRed (短波红外)

*2 同轴测量所得辐射强度对比



▶ 高光谱成像检测

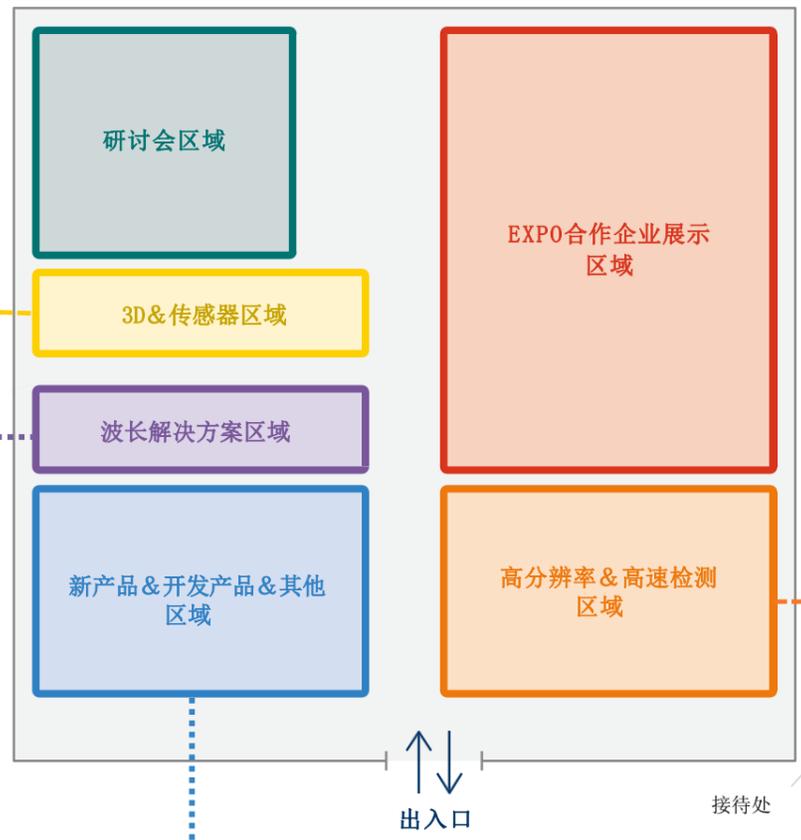
通过分析高光谱相机专用的宽带红外LED光源照射所获得的波长数据，我们可以对不同材质的检测对象物进行分类检出。

同过去广泛使用的卤素光源相比，此光源可对不同材质的检测对象物进行分类检出。大幅度降低了对检测对象物的热影响以及波长随时间所产生的变化，从而提供稳定的检测环境。

▶ 使用多波段光源的图像评估系统 **NEW**

基于多个波长拍摄所得图片，可对检测对象物可否色差判别进行模拟的评估系统。从而推导出适用于颜色和材质识别的光学设置。

Machine Vision Solution **EXPO** 2024 in **横浜** YOKOHAMA 一 展示区域分布图 一



高分辨率 & 高速检测区域

▶ 线扫相机+光度立体FPGA高速图像处理 **NEW**

针对去除工件表面的图案和光晕，捕捉褶皱和伤痕等的外观检测，通过结合使用 Visual Applets的FPGA处理，可提高检测速度。

像素数是传统的2倍，扫描速度是传统的10倍，进行实时的图像处理。

▶ 超高速面阵相机成像 **NEW**

将展示使用大功率频闪LED光源和高帧率相机的高速成像解决方案。我们可根据您的要求，为高速生产线提供不易受上下移动和振动影响的全套检测环境。

▶ 可捕捉细微划痕、倾斜和凹痕的成像解决方案

展示将细微的特征可视化的案例，CCS提供光源并利用其在光学方面的丰富专业知识将细微特征可视化。

■ 瞳孔分离偏光装置 & 双折射瞳孔缓冲装置

采用适用于机器视觉的独特光学技术，将纳米级的细微伤痕、倾斜等可视化。

■ 集成大型镜头平行度可变一体化同轴光源

照射光可变的光源和远心镜头一体化，无需与相机进行光轴对准，可进行调整以便检测出不同程度的缺陷。

■ 通过屏幕投影对透明物体进行成像的技术

搭载大功率LED光源和低倍率镜头，通过照射出极高指向性的光线，可对透明物体中难以观察到的凹凸和纹理进行取像。



新产品 & 开发产品 & 其他区域

▶ 光泽 & 立方体形状工件外观检测解决方案 **NEW**

■ 成像实例：弧形电镀件



减弱光源的倒影，凸显凹凸不平区域

■ 成像实例：手柄



凸显形状复杂工件在表面凹凸不平区域采像

▶ 电源PD4系列 扩大产品阵容 **NEW**

新增小型30W及120W 8通道类型，新增输入触发信号进行顺序切换、

可选择点灯控制设置执行顺序的功能，使用变得更方便。

▶ 支持大容量 & 快速点灯切换光源控制器 CCS-CB-MT 系列 **NEW**

可搭载多台大功率线光源，可对应快速点灯切换的图像检测案例。

将展示4通道合计1,200W控制器的使用实例。

可同时获取用多个光源进行采像的图像，可集成到多扫描系统中。

▶ 超亮大功率灯箱 PFBR-2400SW **NEW**

超大输出功率，亮度约是PFBR-600SW的4倍，不会有氙气灯因脉冲而产生亮度波动的问题，从而可提供稳定的检测环境。无需更换灯泡，大大降低了维护成本。



▶ 使用定制光源解决难题的实例 **NEW**

根据检测环境和案件的实际情况，将从丰富的定制光源案例中挑选出一些有特点的进行展示，如适合管状工件内表面检测的环形光源，可以根据工件的尺寸使照射光成为最适合状态的镰刀形圆顶光源。

▶ 高照度线光源 **NEW**

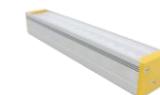
可适用于对亮度和均匀性均有要求的检测案例，将展示适用于描金画金属等表面检测的线光源。独特的光学技术，在照射距离为50~100mm的条件下，可实现高照度高均匀照射。

▶ 贴片LED光源 **NEW**

亮度约是传统炮弹型LED光源的2~3倍，将展示超薄贴片LED环形光源及专为小型工件检测而设计的多段式环形光源。

▶ 大功率 & 灵活配光的LED光源 Effilux **NEW**

将展示通过改变透镜位置和漫射板，来设定各种条件下的最佳照射光线的EFFI-FLEX2系列光源。多功能条形光源，最长可做到2900mm，可见光光源、紫外光源、红外光源可选。内置驱动，无需使用控制器，节约了成本和空间。



※根据实际情况，展示内容可能会有变化。请联系销售代表了解展示相关产品在各地区是否可以售卖。